

INVITACIÓN

Estimado(a) Sr (a).: Las instituciones de la Red Nacional de Metrología, tiene el agrado de invitar a usted al

SEMINARIO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES

Lugar: Hotel Fundador. Paseo Serrano 34, Santiago.
(Estación de Metro Universidad de Chile)

Fecha: miércoles 8 de octubre de 2008

Horario: 9:00 a 18:00 horas

Público objetivo: Encargados de aseguramiento de calidad de industrias y empresas de servicio, laboratorios de ensayo y calibración.

Precio: Gratuito

Cupos: Hasta agotar disponibilidad

Consultas y confirmaciones: ruben.verdugo@inn.cl, fgarcia@metrologia.cl

www.metrologia.cl

SEMINARIO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES

TEMAS

1. SISTEMA NACIONAL DE METROLOGÍA – SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
2. ¿CÓMO VENDEMOS METROLOGÍA A TOMADORES DE DECISIONES?
3. INCERTIDUMBRE DE MEDIDA
4. MANEJO ESTADÍSTICO DE RESULTADOS
5. EJEMPLOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y METROLÓGICOS

Esta será una oportunidad única para compartir con especialistas en metrología y la acreditación de laboratorios.

SEMINARIO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES

HORARIO	TEMA	ESPOSITOR
9.00-9.30	PALABRAS INICIALES MARCO CONEPTUAL	RUBEN VERDUGO/ INN
9.30 – 10.00	SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA	MANUEL LLADSER/ INN
10.00 – 10.15	CAFÉ	
10.15 – 11.00	SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION	EDUARDO CEBALLOS/ INN
11.00 –12.00	¿CÓMO VENDEMOS METROLOGIA?	CELESTINO MENESES / Intronica
12.00 - 12.30	MESA REDONDA	
12.30 – 13.30	ALMUERZO	
13.30 – 14.30	INCERTIDUMBRE DE MEDIDA	FRANCISCO GARCIA/ CESMEC LCPN Masa
14.30 – 15.30	MANEJO ESTADÍSTICO DE RESULTADOS	RODRIGO RAMOS/ Universidad de Concepción LCPN ME
15.30 – 16.00	CAFÉ	
16.00 – 17.00	SISTEMA GESTION MODELO	JAIME MUÑOZ / IDIC LCPN F
17.00 – 18.00	MESA REDONDA	